

# Sheet Resistance Measurement

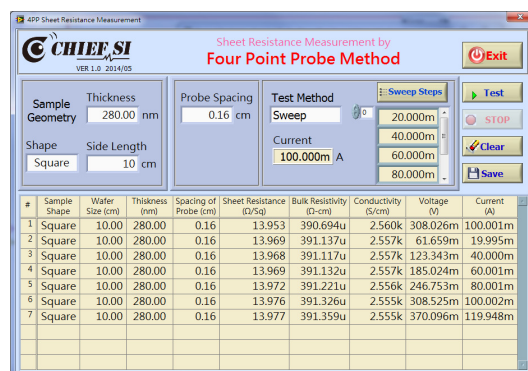


## 快速而直覺化的四點探針薄膜電阻量測系統：

運用四點探針測量原理，量測各式片狀、塊狀之導體、半導體材料以及導電薄膜之薄膜電阻(Sheet Resistance，又稱薄層電阻、亦稱片電阻)。搭配高精度的四點探針台以及快速準確的 SMU (Source Measure Unit)，可輕易量得材料之薄膜阻抗，並廣泛應用於半導體、太陽能、OLED、微機電、燃料電池等各式產業上。

## 系統特色：

- 方便易上手、直覺化的軟體操作介面。
- 精密量測待測物之薄膜電阻。
- 定電流量測。可選擇單點量測或多點掃描。
- 已知薄膜厚度之情況下，同時推算出體電阻率(Bulk Resistivity)與電導率(Conductivity)。
- 採用.CSV 檔案儲存格式，方便使用者進行資料處理。
- 預設搭配 Keithley 2400 SMU。亦可依使用者需求，配合各式 SMU 與微、高阻計客製化操作軟體。



## 規格：

Chuck size	6", 8", 12"	Measure item	Sheet Resistance, Bulk Resistivity, Conductivity
Sample geometry	Circle or Square	Interface	RS-232 or GPIB
Head Up/Down	16mm	Language	English
Correct factor	Thickness & Geometry	PC Requirements	CPU:P4, HD:1GB, USB 2.0
Probe Pin Material	BeCu (or Tungsten Carbide)	Monitor Requirements	1280*800 resolution
Probe Pin Spacing	40mil, 50mil, 62.5mil	O.S. Supported	Windows XP, WIN 7
Probe Pin Spring	45grams, 85grams, 180grams	SMU Support	Keithley 2400 / 2401